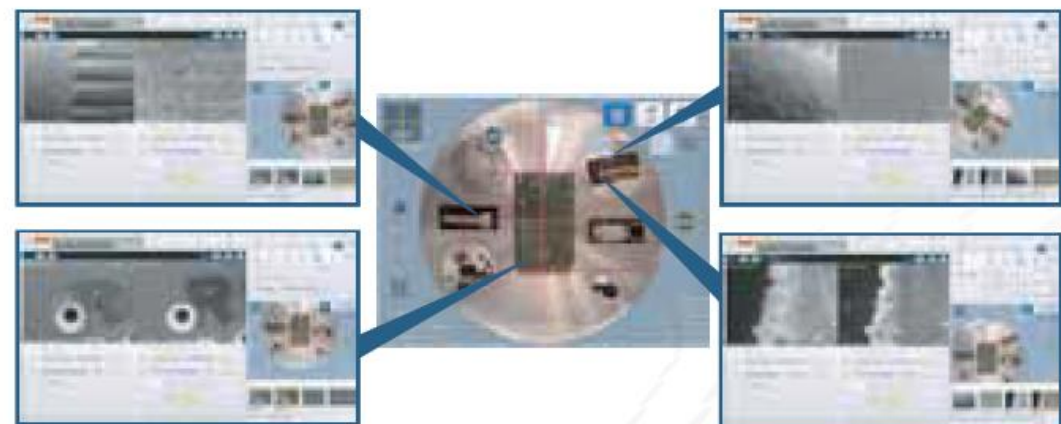


# 日立走査電子顕微鏡 SU3800/SU3900のご紹介

Introduction of Scanning Electron Microscope SU3800/SU3900



SU3800/SU3900は操作性と拡張性を両立させました。数々の操作もオート化し操作性を向上させています。広角カメラナビゲーションシステム対応のSEM MAPでオペレータのスムーズな操作をサポートします。また、多目的試料室を標準搭載し、多種のアクセサリを搭載可能です。



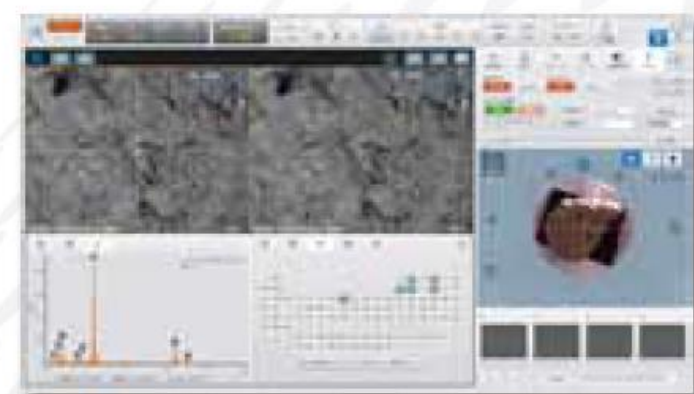
広域SEM MAP(φ127 mm)

- **広角カメラナビゲーションシステム**  
最大観察視野 (127 mm φ/ 200 mm φ) 全域をカバー  
**Ultra-Wide NaviCam FOV**  
Covering full observation sample area (127 mm φ/ 200 mm φ)

- **インテリジェントフィラメントテクノロジー**  
フィラメントコンディションの自動最適化と長時間使用  
**Intelligent Filament Technology**  
Auto optimization for improved filament performance and lifetime

- **高機能EDSとのフルインテグレーション**  
**Fully Integrated High-Quality EDS Capability**

- **大型試料室による大型試料対応(SU3900)**  
**Extra-Large Chamber For Large-Sample Observation (SU3900)**



EDSインテグレーション UI



大型試料室搭載(SU3900)  
最大試料サイズ:300 mm φ  
最大試料高さ:130 mm 重量:5 kg(X/Y)

# 多目的大型チャンバを標準搭載し、 大型試料の解析に対応。

## 大型/重量試料対応ステージ

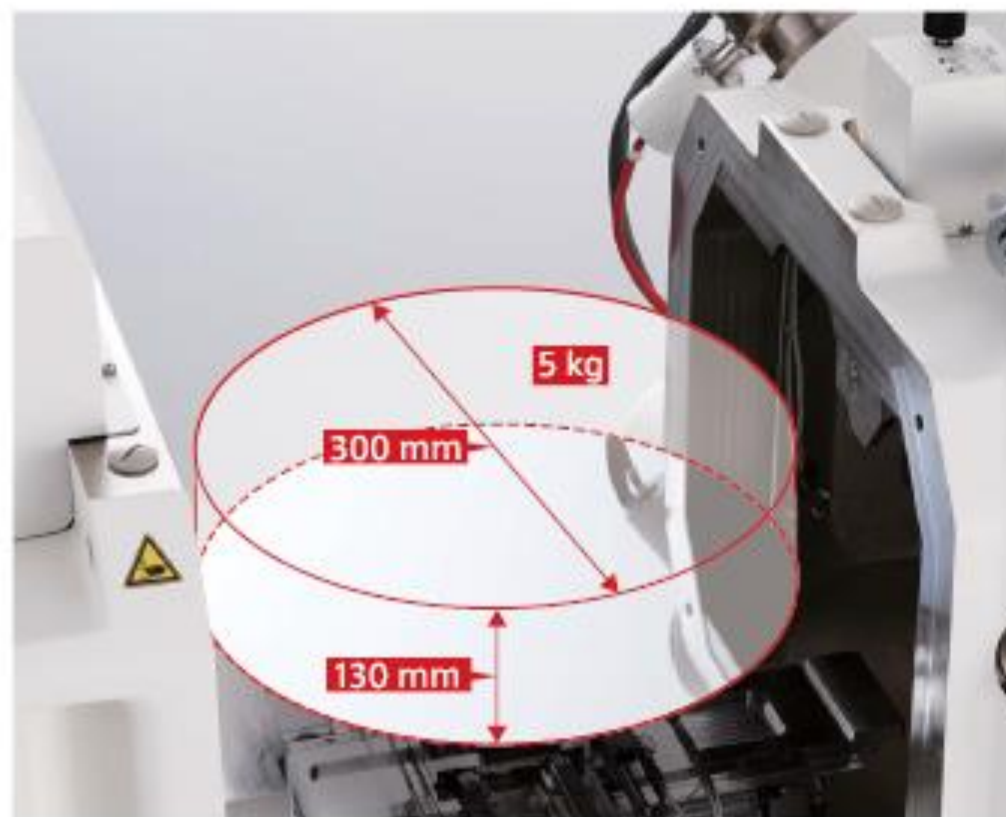
SU3800/SU3900は大型/重量試料対応のステージを備えています。

	SU3800	SU3900
最大試料寸法	200 mm径	300 mm径
最大観察可能範囲	130 mm径	200 mm径
最大搭載可能重量*	2 kg	5 kg (TZR無し)
最大搭載可能高さ	80 mm	130 mm

\*別途重量ホルダ（オプション）の使用を推奨します。

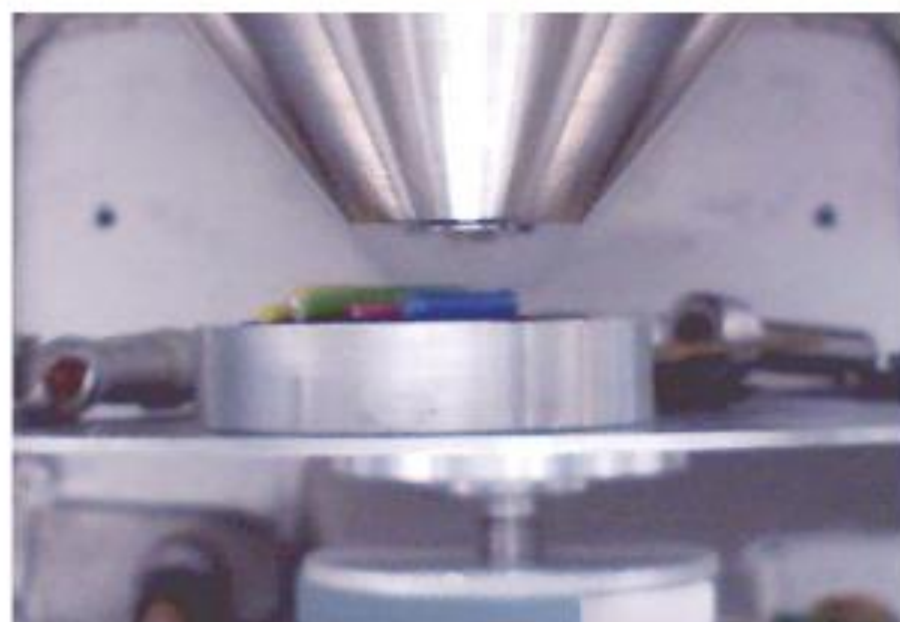


ドリル工具 (高さ130 mmH) 装着例  
ドリル工具先端部 (分析最適位置WD=10 mm)



## ステージ移動の安全性を高める、チャンバスコープ\*

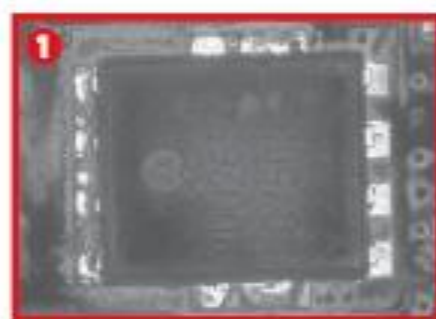
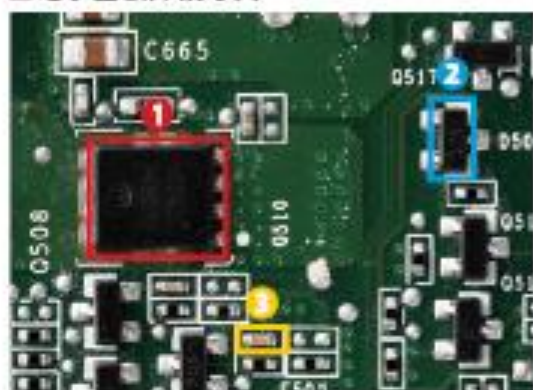
チャンバスコープは、試料室内部をモニターするための装置です。赤外線カメラを用いることで、SEM画像を観察しながら同時に試料室内部のモニタリングが行えます。より詳細な位置を把握するためにチャンバスコープ画像の拡大や、観察位置の移動も可能となりました。



## 複数領域の広域観察を可能にする、Multi Zigzag\*

Zigzag機能は連続した視野を自動的に取得できます。Multi Zigzagは試料台上の複数の箇所でZigzag設定が可能で、複数枚の高倍率画像を異なる視野で撮影でき、取得した画像をViewer機能でつなぎ合わせることで広域画像を作成できます。

■電子基板外観写真



① 観察倍率: ×30  
取得枚数: 3×3枚



② 観察倍率: ×50  
取得枚数: 2×3枚



③ 観察倍率: ×100  
取得枚数: 2×1枚

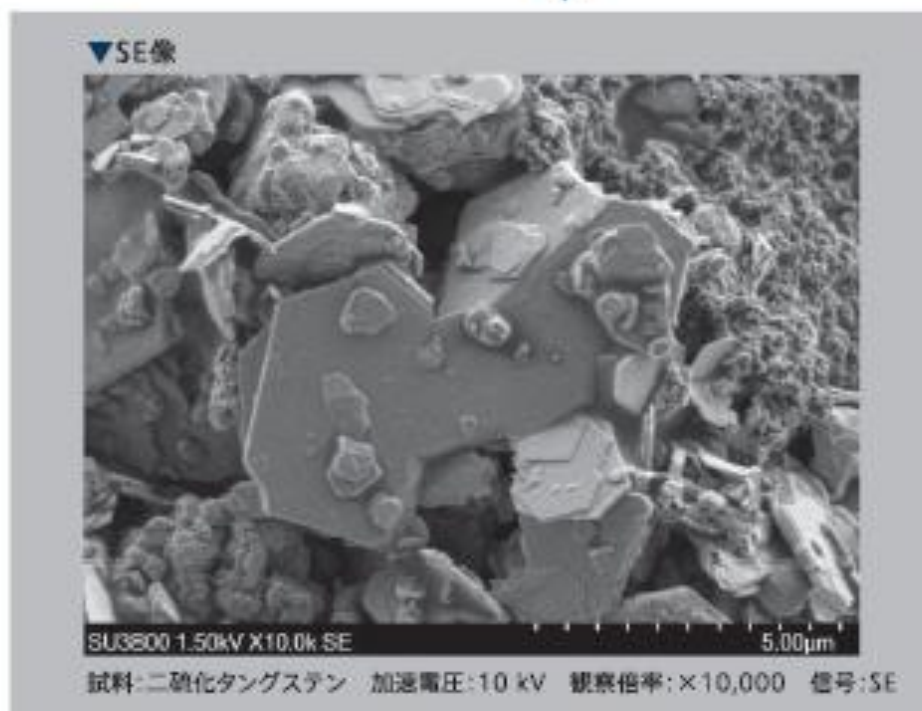
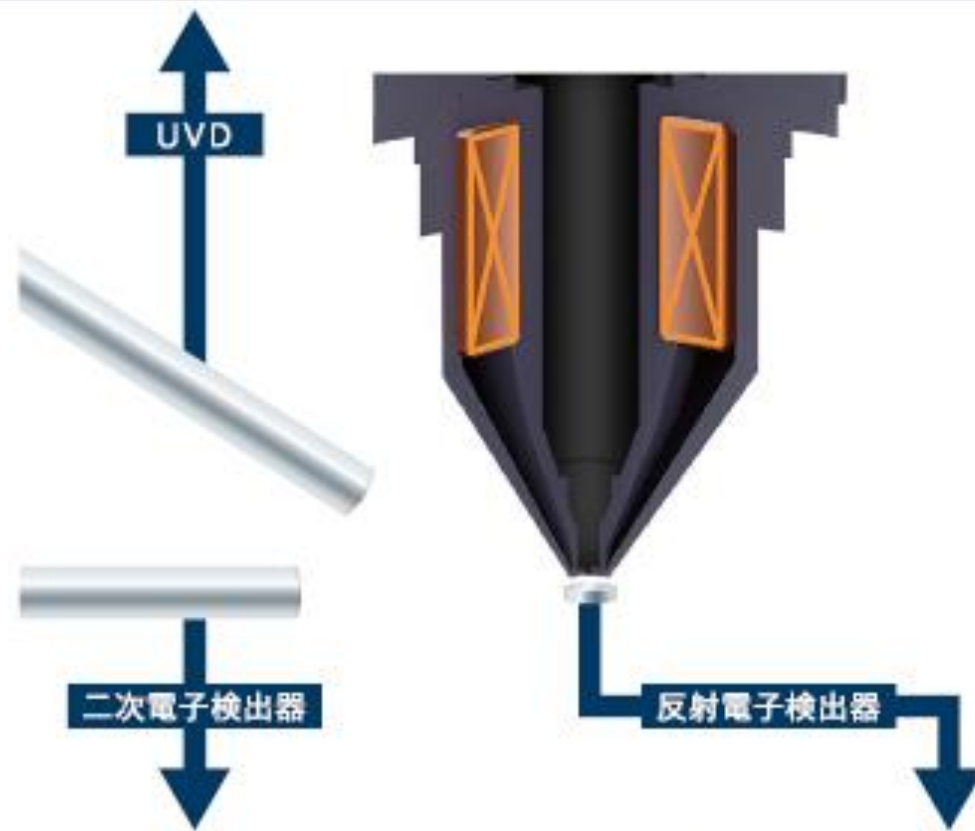
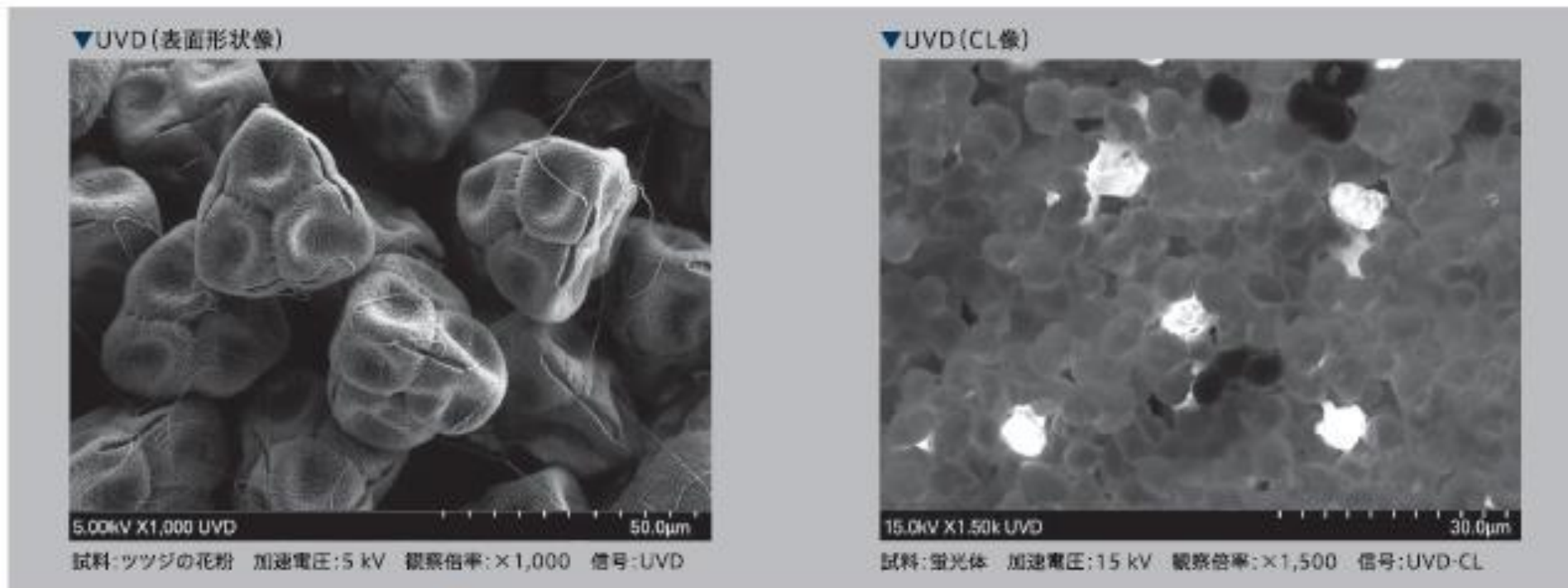
\*オプション

ちから～



# 多様な観察ニーズに対応する検出器。

SU3800/SU3900は、多様化する観察ニーズに対応するため、真空モードや検出機能を拡張しています。二次電子検出器、真空モードを問わず動作可能な高感度半導体反射電子検出器のほかに、UVD\*を装着できます。UVDは凹凸情報と電子線照射により発生した光(CL情報)を取得できます。



※オプション

